

# EDA/CAD para Nanoelectrónica

2° Semestre 2020 / 2021

## Relatório

Lab#1: Estudo e Aplicação do Modelo NPower

25/04/2021

Número de Aluno	Nome	Turno Prático
50726	Francisco Mendes Micaelo André	P1
51005	José Maria Corrêa Arouca Cortes Tamagnini	P1
43853	Rafael Gonçalves Feio de Oliveira	P1

Docente: Maria Helena Fino





# Índice

Introdução	4
I-Objetivo	5
II - Apresentação do Modelo <i>NPower</i>	6
2.1. Descrição do Modelo	6
III - Metodologia	7
3.1. LTspice	7
3.2. Python - Spyder	10
IV - Resultados	12
4.1. Parâmetros Obtidos	12
4.2. Analise de Resultados	12
V - Conclusões	16
Bibliografia	17
Anexos	18
Trabalho1_70nm.py	18
Trabalho1 700nm.py	21



# Índice de Figuras

Figura 1 Esquemático para NMOS 700n
Figura 2 Características <i>ID</i> em função de <i>VDS</i> , NMOS com W=L=700 nm
Figura 3-Características de <i>ID</i> em função de <i>VDS</i> , NMOS com W=L= 70 nm8
Figura 4 - Característica de <i>ID</i> em função de <i>VGS</i> , NMOS com W=L= 700 nm8
Figura 5 - Característica de <i>ID</i> em função de <i>VGS</i> , NMOS com W=L= 70 nm9
Figura 6 - Estrutura das dataframes utilizadas para armazenar: a) IDVDS;
b) $IDVGS\ com\ VDS = 1.2\ V$
Figura 7 – Curvas IDVDS, com VGS fixo para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm
Figura 8 - Curvas <i>IDVGS</i> , com <i>VDS</i> = 1.2 <i>V</i> para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm
Figura 9 - Curvas <i>IDgm</i> , com <i>VDS</i> = 1.2 <i>V</i> para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm
Figura 10 - CurvasID(VGS), para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm; c) W=L=700 nm (escala
logarítmica);
W=L=70 nm (escala logarítmica) 14
Figura 11 - Erro de <i>ID</i> 2( <i>VGS</i> ) em relação a <i>ID</i> ( <i>VGS</i> ), para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm
14
Índice de Tabelas
Tabela 1 – Transístores utilizados
Tabela 2 – Parâmetros obtidos



#### Introdução

No âmbito da cadeira de EDA/CAD para Nanoelectrónica, é apresentado o primeiro trabalho laboratorial onde é realizado o estudo do modelo *NPower* para a caracterização de transístores MOSFETs de tecnologia nanométrica [1].

Este trabalho está dividido em várias etapas de desenvolvimento, de modo a estudar e comparar o modelo NPower com o modelo tradicional de Shockley, comumente conhecido como modelo quadrático, dada a variação quadrática da corrente de "dreno",  $I_D$ , com a tensão entre a "gate" e a "source",  $V_{GS}$ , na zona de saturação, verificando quais as limitações de ambos os modelos.

Na primeira parte do projeto é realizada a descrição do modelo *NPower*, que permite determinar os parâmetros de funcionamento do circuito através de equações de variáveis simples, minimizado os erros associados ao cálculo das variáveis de decisão do modelo. Após a descrição do modelo teórico utilizado (*NPower*), são retiradas as características das correntes  $I_D$ , dependendo da tensão  $V_{GS}$  e  $V_{DS}$ , através do software *LTspice*.

Na segunda parte do trabalho é feita a implementação do modelo *NPower*, obtendo as características do modelo, calculando o erro relativo entre os dados teóricos e simulados, utilizando o software *Spyder*. Por último foram retiradas as conclusões da realização do trabalho prático, com base nos dados obtidos através da abordagem teórica utilizada.

DEE / FCT-UNL 4 / 23



## **I-Objetivo**

Este projeto tem como objetivo a determinação dos parâmetros de funcionamento dos transístores MOSFET de 90nm para uma relação comprimento e largura igual (W=L), verificando quais as limitações do modelo NPower. Arrêntiela présenta as especificações dos transístores utilizados para aplicação da respetiva metodologia.

Tabela 1 – Transístores utilizados

	Modelo	W(nm)	L(nm)
NMOS4	90nm_NMOS_bulkL70n	70	70
NMOS4	90nm_NMOS_bulkL700n	700	700

O modelo de *Shockley* torna-se uma aproximação imprecisa para descrição do funcionamento de dispositivos MOSFET de dimensões nanométricas. Deste modo, este trabalho apresenta os desafíos da utilização do modelo *NPower*.

DEE / FCT-UNL 5 / 23



#### II - Apresentação do Modelo NPower

### 2.1. Descrição do Modelo

O modelo *NPower* é descrito pelo sistema equações (1), onde os parâmetros  $I_D$  e  $I_{DSAT}$  representam as correntes no dreno e de saturação nos transístores MOSFET. A tensão de saturação no "dreno" é representada por  $V_{DSAT}$ , enquanto  $V_{GS}$  e  $V_{DS}$  descrevem a tensão de entre a "gate-source" e "dreno-source" respetivamente e  $V_T$  a tensão de "threshold". As seguintes equações dependem das características físicas da tecnologia utilizada, como a largura do canal W e o seu comprimento de canal  $L_{eff}$ . Os parâmetros K e m controlam as características da região linear (tensão linear de saturação), enquanto o B e n determinam as características da região de saturação. Por último, a variável  $\lambda$  expressão uma relação entre a condutância do "dreno" na zona linear de saturação.

$$I_{D} = \begin{cases} 0, & V_{GS} \leq V_{T} \\ I_{DSAT}(1 + \lambda V_{DS}) \left(2 - \frac{V_{DS}}{V_{DSAT}}\right) \frac{V_{DS}}{V_{DSAT}}, & V_{GS} \geq V_{T} \wedge V_{DS} \leq V_{DSAT} \\ I_{DSAT}(1 + \lambda V_{DS}), & V_{GS} \geq V_{T} \wedge V_{DS} \geq V_{DSAT} \end{cases}$$
(1)

Onde:

$$V_{DSAT} = K(V_{GS} - V_T)^m (2)$$

$$I_{DSAT} = B \frac{W}{L_{eff}} (V_{GS} - V_T)^n \tag{3}$$

DEE / FCT-UNL 6 / 23



#### III - Metodologia

## 3.1. LTspice

Na primeira etapa do projeto foi utilizado o programa LTspice para <u>simular o ponto de</u> <u>funcionamento do circuito</u> <u>CMOS</u> apresentado na Figura 1, tendo em conta dois cenários de simulação distintos.

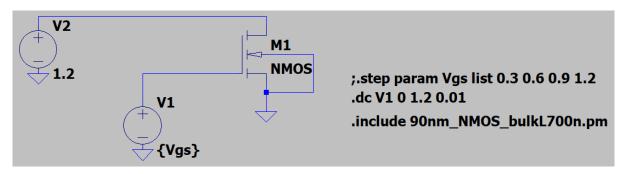


Figura 1 Esquemático para NMOS 700n

O primeiro cenário de simulação corresponde à obtenção da corrente  $I_D(V_{DS})$  para valores de  $V_{GS}$  fixos onde  $V_{GS} = \{0,3;0,6;0,9;1,2\}$  V. Assim, recorrendo ao circuito da figura 1, foi utilizado transístor NMOS de 90nm com W=L=700nm obtendo os seguintes resultados:

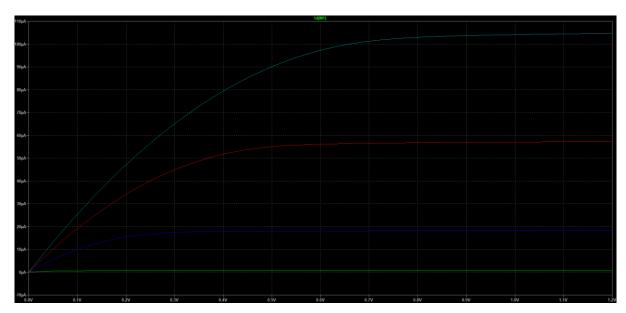


Figura 2 Características  $I_D$  em função de  $V_{DS}$ , NMOS com W=L=700 nm

Na Figura 2 podemos observar que a característica de  $I_D$  tem tendência a com o crescimento de  $V_{GS}$  variar entre  $0.6\mu A$  e  $105\mu A$ .

DEE / FCT-UNL 7 / 23



De seguida, foi repetida a simulação para um NMOS de 90nm para W=L=70nm. Na Figura 3 observamos que tal como na figura 2, a corrente  $I_D$  tende a estabilizar com o aumento de  $V_{DS}$  no entanto a amplitude de correntes é menor, variando de  $2\mu A$  a  $67\mu A$ 

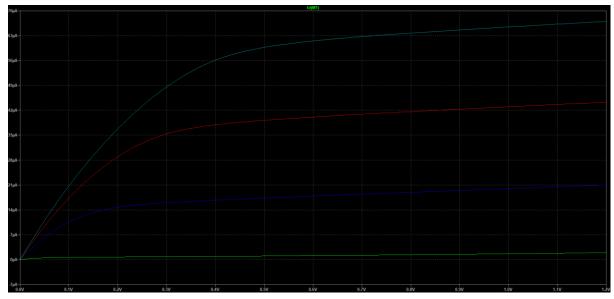


Figura 3-Características de  $I_D$  em função de  $V_{DS}$ , NMOS com W=L= 70 nm

O segundo cenário de simulação corresponde à obtenção da corrente  $I_D(V_{GS})$  para um valor fixo de  $V_{DS}$  igual a 1.2V, para os dois circuitos NMOS de 90nm. Os resultados obtidos da simulação do circuito para uma relação W=L=700nm, são apresentados na Figura 4. Podemos verificar que com o aumento da tensão  $V_{GS}$  a corrente  $I_D$  irá aumentar exponencialmente, atingindo um máximo em  $105\mu A$ .

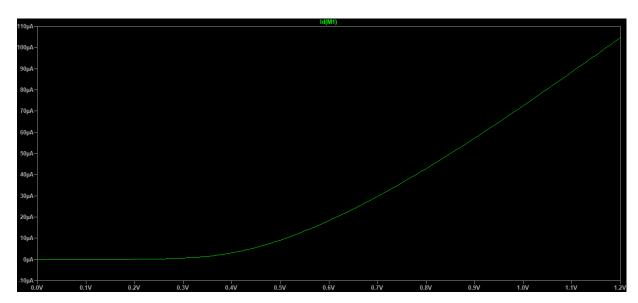


Figura 4 - Característica de  $I_D$  em função de  $V_{GS}$ , NMOS com W=L= 700 nm

DEE / FCT-UNL 8 / 23



Repetindo a mesma simulação para o NMOS com W=L=70nm, são obtidos os resultados apresentados na figura 5. Podemos verificar a mesma relação entre a corrente  $I_D$  e  $V_{GS}$ , para um valor fixo de tensão  $V_{DS}$  igual a 1.2V.

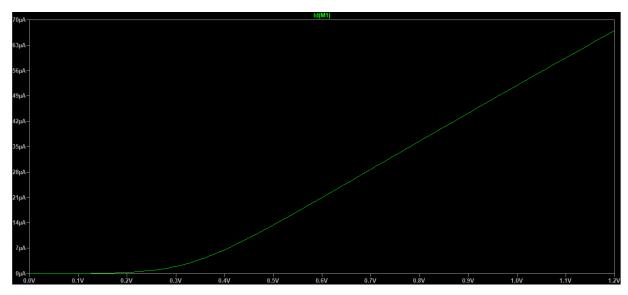


Figura 5 - Característica de  $I_D$  em função de  $V_{GS}$ , NMOS com W=L= 70 nm

Após a simulação de ambos os circuitos para os dois cenários de simulação estabelecidos, são extraídos os dados referentes às curvas características <u>do ponto de funcionamento do circuito</u>, efetuando a manipulação dos dados com o auxílio do software *Spyder*, aplicando o modelo *NPower*.

DEE / FCT-UNL 9 / 23



#### 3.2. Python - Spyder

Nesta secção é feita <u>a modelação dos dados simulados</u>, <u>de modo a implementar a metodologia NPower para o estudo e análise do comportamento do circuito CMOS anteriormente</u>. O modelo é implementado em *Python*.

Uma vez obtidos os dados referentes às curvas  $I_D(V_{GS})$  e  $I_D(V_{DS})$ , os mesmos são carregados no *Spyder* em duas *dataframes* distintas, cuja estrutura está representada na Figura 6.

Index	Vgs	0.3	0.6	0.9	1.2
0	0	7.67879e-11	-3.8077e-10	-6.63765e-09	-4.55334e-08
1	0.01	1.2651e-07	1.18762e-06	2.10014e-06	2.67093e-06
2	0.02	2.32704e-07	2.33105e-06	4.16423e-06	5.34983e-06
3	0.03	3.1945e-07	3.43003e-06	6.18566e-06	7.99081e-06
4	0.04	3.87942e-07	4.48468e-06	8.16448e-06	1.05938e-05
5	0.05	4.39919e-07	5.49514e-06	1.01008e-05	1.31588e-05
6	0.06	4.77733e-07	6.46152e-06	1.19946e-05	1.5686e-05
7	0.07	5.04202e-07	7.38399e-06	1.3846e-05	1.81752e-05
8	0.08	5.22233e-07	8.26267e-06	1.56552e-05	2.06267e-05
9	0.09	5.34385e-07	9.09774e-06	1.74221e-05	2.30404e-05
10	0.1	5.42628e-07	9.88936e-06	1.91468e-05	2.54164e-05
a)					

Index	v1	ld(M1)
0	0	-6.76386e-08
1	0.01	-6.35972e-08
2	0.02	-5.97355e-08
3	0.03	-5.60305e-08
4	0.04	-5.2456e-08
5	0.05	-4.89824e-08
6	0.06	-4.5575e-08
7	0.07	-4.21929e-08
8	0.08	-3.87871e-08
9	0.09	-3.52983e-08
10	0.1	-3.16543e-08
	b)	

Figura 6 - Estrutura das dataframes utilizadas para armazenar: a)  $I_D(V_{DS})$ ; b)  $I_D(V_{GS})$  com  $V_{DS} = 1.2 V$ 

De seguida foram obtidos os parâmetros  $V_T$ , n,  $\lambda e B$ .

A função gm(Id, Vgs) que calcula os vários valores da transcondutância gm, através da equação (3.1).

$$gm = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \tag{3.1}$$

Após o calculo da transcondutância é efetuada a relação  $\frac{I_D}{gm}$ , variável utilizada para o curve\_fit à função  $get\_n\_vt(Vgs, n, Vt)$ , com os valores de  $V_{GS}$  e os valores de  $\frac{I_D}{gm}$ , a partir do qual é possível determinar os parâmetros n e  $V_T$ . A função  $get\_n\_vt$  realiza o cálculo de (3.2).

$$\frac{I_D}{gm} = \begin{cases} 0, & V_{GS} < V_T \\ \frac{V_{GS} - V_T}{n}, & V_{GS} \ge V_T \end{cases}$$
(3.2)

DEE / FCT-UNL 10 / 23



Onde:

$$gm = B \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_T)^{n-1} (1 + \lambda V_{DS})$$
 (3.3)

$$I_D = B \cdot \frac{W}{I} \cdot (V_{GS} - V_T)^n (1 + \lambda V_{DS})$$
(3.4)

O parâmetro  $\lambda$  é calculado partir do declive das curvas características do gráfico simulado  $I_D(V_{GS})$ , selecionando dois pontos na região linear de saturação, formulando a sua expressão através da equação (3.5).

$$\lambda = \frac{I_{D1} - I_{D2}}{I_{D2} \cdot V_{DS1} - I_{D1} \cdot V_{DS2}} \tag{3.5}$$

Por último, é determinado o parâmetro <u>B</u> através de um *curve\_fit* à função  $get\_B(Vgs, B)$ , que recebe como parâmetros de entrada os valores de  $V_{GS}$  e de  $I_D(V_{GS})$ . A função  $get\_B$  realiza o cálculo apresentado em (3.6).

$$I_{D} = \begin{cases} 0, & V_{GS} < V_{T} \\ B \cdot (V_{GS} - V_{T})^{n} \cdot (1 + \lambda \cdot V_{DS}), & V_{GS} \ge V_{T} \end{cases}$$
(3.6)

Calculados todos os parâmetros de entrada necessários para a implementação do modelo descrito, é estabelecida a função  $get\_Id(Vgs, Vds, Vt, n, L, B)$  que executa o cálculo do valores de corrente de  $I_D$  teóricos, através do sistema de equações (3.6), armazenados no vetor  $\underline{Id2}$  referente à implementação computacional.

Por fim calculou-se o erro relativo dos novos valores de  $I_D$ ,  $I_{D2}$ , em relação aos valores de  $I_D$  obtidos através do LTSpice,  $I_{DLT}$ , através de (3.7).

$$Erro(V_{GS}) = \frac{I_{D2} - I_{DLT}}{I_{DLT}} * 100$$
 (3.7)

Esta metodologia foi utilizada para os dois ensaios realizados, e o código para os mesmos pode ser consultado em Anexos

DEE / FCT-UNL 11 / 23



#### IV - Resultados

#### 4.1. Parâmetros Obtidos

Aplicando a metodologia apresentada no Capítulo III, foram obtidos os seguintes parâmetros, registados na Tabela 2.

NMOS 90nm	$V_t$	n	В	λ
W=L=700nm	$3.160 \cdot 10^{-1}$	1.467	$1.218 \cdot 10^{-4}$	$2.678 \cdot 10^{-2}$
W=L=70nm	$3.002 \cdot 10^{-1}$	1.031	$6.432 \cdot 10^{-5}$	$1.345 \cdot 10^{-1}$

Tabela 2 – Parâmetros obtidos

#### 4.2. Analise de Resultados

Neste Capítulo são apresentados os dados obtidos da implementação do modelo *NPower* com recurso ao software *Spyder*.

Primeiramente foi aplicada a seguinte metodologia para os transístores NMOS de 90nm com respetivas relações de igualdade W=L, para 700nm e 70nm. Na Figura 7 são apresentadas as curvas das respetivas características referentes a  $I_D(V_{DS})$  para  $V_{GS} \in \{0.3,0.6,0.9,1.2\}V$ .

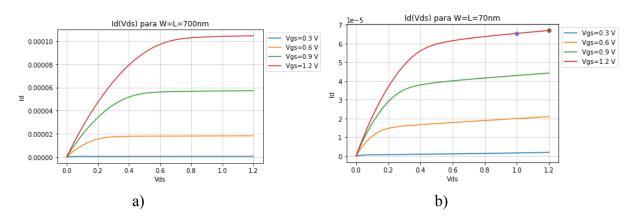


Figura 7 – Curvas  $I_D(V_{DS})$ , com  $V_{GS}$  fixo para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm

Seguidamente foi realizada a simulação do segundo cenário de operação, onde foram obtidas as curvas características  $I_D(V_{GS})$  para  $V_{DS}$  igual a 1.2V, considerando as diferentes relações W=L. A Figura 8 apresenta os resultados obtidos da simulação dos circuitos em análise.

DEE / FCT-UNL 12 / 23



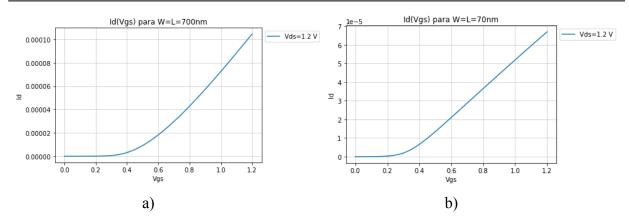


Figura 8 - Curvas  $I_D(V_{GS})$ , com  $V_{DS} = 1.2 V$  para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm

Tendo em conta os dados recolhidos referentes às simulações realizadas, foi implementada a metodologia descrita na secção anterior. Deste modo, recorrendo à equação (3.2) foram obtidos os gráficos representados na Figura 9 que expressam a relação  $\frac{I_D}{gm}$  simulado e modelado para os respetivos circuitos W=L.

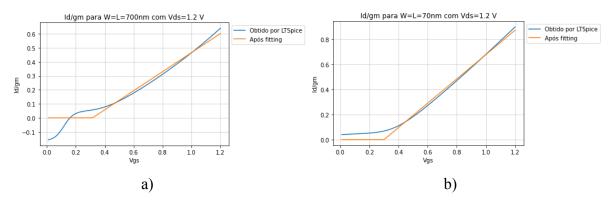


Figura 9 - Curvas  $\frac{I_D}{am}$ , com  $V_{DS}=1.2~V$  para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm

Analisando os resultados modelados obtidos é possível verificar que as cuvas têm uma boa aproximação aos resultados simulados quando  $V_{GS} \ge V_T$ . Deste modo, podemos assumir que aproximação realizada para determinar os parâmetros n e  $V_T$  é bastante precisa.

Após o cálculo de todos os <u>parâmetros de entrada</u> para a implementação do modelo *NPower*, foram determinados as curvas características  $I_D(V_{GS})$  para ambos os circuitos W=L. Na figura 10 são representadas as respetivas curvas  $I_D(V_{GS})$  simuladas e modeladas (NPower) para ambos os circuitos W=L, tanto em escala linear como em escala logarítmica.

DEE / FCT-UNL



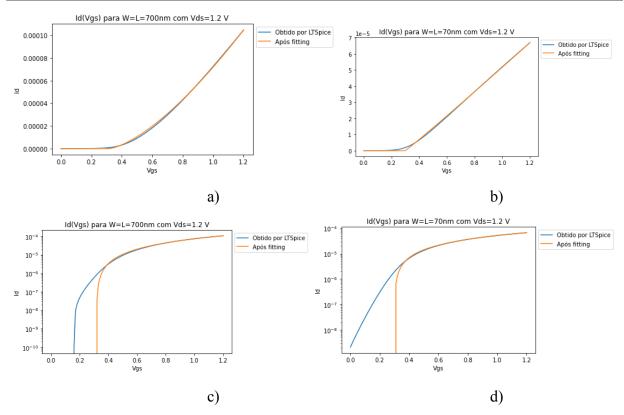


Figura 10 - Curvas $I_D(V_{GS})$ , para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm ;c) W=L=700 nm (escala logarítmica) ; d) W=L=70 nm (escala logarítmica)

Estabelecendo uma comparação de modo grosseiro entre os resultados simulados e modelos, podemos afirma que o modelo *NPower* tem uma boa aproximação para a região linear (saturação,  $V_{GS} \ge V_T$ ).

Contudo, de modo a determinar qual o grau de precisão dos resultados obtidos, foi calculado o valor do erro relativo entres os valores simulados e modelados, observando a variação do valor do erro tendo em consideração a tensão  $V_{GS}$  do componente NMOS. Na Figura 11 são apresentados os gráficos referentes aos erros relativos para ambos os circuitos W=L, considerando apenas erro pera valores  $V_{GS} \ge V_T$ .

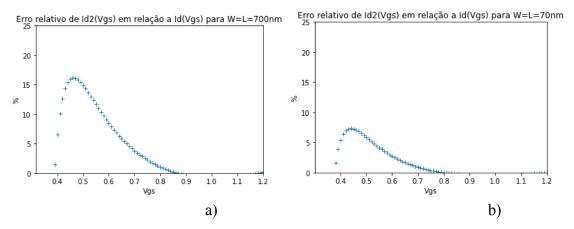


Figura 11 - Erro de  $I_{D2}(V_{GS})$  em relação a  $I_D(V_{GS})$ , para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm

DEE / FCT-UNL 14 / 23



Analisando os dados da Figura 11, podemos verificar que o erro relativo é superior para transístores com canais de maiores dimensões. Uma vez que apenas se considerou a região  $V_{GS} \ge V_T$ , é visível que o maior de valor de erro relativo acontece no limiar da zona de saturação.

DEE / FCT-UNL 15 / 23



#### V - Conclusões

Com a realização deste trabalho laboratorial foram abordados vários conceitos que nos permitem retirar algumas conclusões em cada uma das partes de desenvolvimento do projeto, descrevendo e analisando o funcionamento de um circuito NMOS 90nm com uma relação W=L.

Assim sendo, inicialmente realizou-se a <u>análise teórica do circuito executando</u> uma simulação para dois pontos de operação diferentes variando a dimensão do transístor, mantendo a relação W=L. Deste modo, segundo a simulação do primeiro ensaio que corresponde à obtenção da corrente  $I_D(V_{DS})$  para valores de  $V_{GS}$  fixos onde  $V_{GS} = \{0,3; 0,6; 0,9; 1,2\} V$ , verificamos que para  $V_{GS} \ge V_T$  a corrente  $I_D$  se encontra na região de saturação. Por outro lado, executando o segundo cenário de simulação, que corresponde à obtenção da corrente  $I_D$  para um valor fixo de  $V_{DS}$  igual a 1.2V, observamos que a corrente  $I_D$  cresce linearmente ao entrar na região de saturação ( $V_{GS} \ge V_t$ ).

Após as simulações do *LTSpice* é descrito e implementado um modelo *NPower* que determina os parâmetros de saída simulados no *LTSpice*, analisando a precisão e incerteza do modelo. Observando os parâmetros resultantes do <u>fitting</u> das curvas de simulação, podemos afirmar que o valor da constante *n* não corresponde exatamente ao fator 2, característica do modelo de *Shockley*, o que revela uma certa incerteza por parte deste último, Tabela 2.

É possível constatar também que o valor de *B* é responsável pela conversão da corrente em tensão onde o seu valor é maior quanto maior forem as dimensões do transístor MOSFET.

Analisando o valor de  $\lambda$  obtido por regressão linear, retirando dois pontos da curva característica  $I_D(V_{DS})$  na região de saturação, podemos averiguar que o valor do  $\lambda$  depende da relação  $I_D(V_{DS})$  onde os efeitos da modulação do canal são mais notórios para transístores de canais mais curtos.

Através do cálculo do erro relativo é visível que este converge para 0 com o aumento do valor de  $V_{GS}$ . Desta maneira, observando os gráficos do erro relativo, para um transístor com W=L=70nm o erro é menor do que para um transístor de dimensões maiores (com a mesma relação W=L), logo o modelo *NPower* é mais preciso/adequado para transístores com canais mais curtos.

Contudo, podemos afirmar que o modelo *NPower* é um modelo simples e compacto que apresenta uma aproximação robusta para o cálculo dos parâmetros de saída do modelo, nomeadamente da corrente  $I_D(V_{DS})$ , concluindo também que as aproximações efetuadas por fitting dos parâmetros correspondem a uma boa aproximação para a implementação do modelo.

Finalizando, o modelo *NPower* apresenta algumas falhas para transístores com diferentes dimensões, com W=L, apresentando um comportamento não escalável.



## Bibliografia

[1] T. Sakurai and A. Richard Newton, "A Simple MOSFET Model for Circuit Analysis," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 38, no. 4, pp. 887–894, 1991, doi: 10.1109/16.75219.

DEE / FCT-UNL 17 / 23



#### Anexos

## Trabalho1\_70nm.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Mon Apr 12 10:59:50 2021
@authors: Rafael, Francisco, José
import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve fit
os.chdir('G:\\O meu disco\\MIEEC\\5º Ano\\2º Semestre\\EDA\\Trabalho 1')
#Dados para Id(Vgs,1.2)
vgs12_70=pd.read_csv('ld_Vgs_12_70nm.txt',sep='\t')
#Dados para Id(Vds), com os 4 ensaios realizados (0.3, 0.6, 0.9, 1.2)
vds_70=pd.read_csv('Id_Vds_70nm.txt',sep='\t')
#Carregar os dados de Id(Vds) para uma dataframe, de modo a ter os 4 ensaios separados
U=[]
U.append(vgs12 70['v1'])
for i in range(0,4,1):
U.append(vds_70['ld(M1)'][1+i*122:122+i*122].to_numpy())
# i*122 - offset entre ensaios, contabilizando a linha da string
vds 70 = pd.DataFrame(U).transpose()
vds_70.columns = ['Vgs','0.3','0.6','0.9', '1.2']
del U, i
plt.figure()
plt.title('Id(Vds) para W=L=70nm')
plt.ylabel('Id')
plt.xlabel('Vds')
for vgs in np.arange(0.3,1.5,0.3):
plt.plot(vds_70['Vgs'], vds_70[str(round(vgs,2))],label='Vgs=%.1f V' %vgs)
plt.plot(vds_70['Vgs'][100], vds_70['1.2'][100], 'o', vds_70['Vgs'][120], vds_70['1.2'][120], 'o'
plt.legend(bbox to anchor=(1, 1))
plt.grid(linewidth=0.5)
del vgs
plt.figure()
plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm')
plt.ylabel('Id')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12 70['v1'],vgs12 70['ld(M1)'], label='Vds=1.2 V')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.grid(linewidth=0.5)
######### Definição de funções ################
def gm(Id,Vgs): #gm= dId/dVgs
return np.diff(Id)/np.diff(Vgs)
def get n vt(Vgs, n, Vt):
return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:(Vgs-Vt)/n])
```

DEE / FCT-UNL 18 / 23



```
def get lambda(ld1,ld2,Vds1,Vds2):
return (Id1-Id2)/(Id2*Vds1-Id1*Vds2)
def get_B(Vgs, B):
return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:B*((Vgs-Vt)**n)* (1+L*1.2)])
# Obtenção dos valores de gm
gm_70 = gm(vgs12_70['ld(M1)'],vgs12_70['v1'])
# Obtenção dos valores de Id/gm
id_gm_70=(vgs12_70['ld(M1)'][1:]/gm_70).to_numpy()
#Obtenção de n e Vt
xx,xy=curve_fit(get_n_vt,vgs12_70['v1'][1:].values,id_gm_70)
n=xx[0]
Vt=xx[1]
#Obtenção dos valores Id/gm após o fitting
id_gm_new=get_n_vt(vgs12_70['v1'][1:].values,n,Vt)
#Obtenção de Lambda
L=get_lambda(vds_70['1.2'][100], vds_70['1.2'][120], vds_70['Vgs'][100], vds_70['Vgs'][120])
#Obtenção de B
xx,xy=curve fit(get B,vgs12 70['v1'].values,vgs12 70['ld(M1)'].values)
B=xx[0]
del xx, xy
#Id/gm antes e após fitting
plt.figure()
plt.title('Id/gm para W=L=70nm com Vds=1.2 V')
plt.ylabel('ld/gm')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12_70['v1'][1:],id_gm_70, label='Obtido por LTSpice')
plt.plot(vgs12_70['v1'][1:],id_gm_new, label='Após fitting')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.grid(linewidth=0.5)
#Id(Vgs) com Vds = 1.2 V antes e após fitting
plt.figure()
plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm com Vds=1.2 V')
plt.ylabel('ld')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12_70['v1'],vgs12_70['ld(M1)'], label='Obtido por LTSpice')
plt.plot(vgs12_70['v1'],get_B(vgs12_70['v1'].values,B),label='Após fitting')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))
#Id(Vgs) com Vds = 1.2 V antes e após fitting em escala logarítmica
plt.figure()
plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm com Vds=1.2 V')
plt.ylabel('Id')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12_70['v1'],vgs12_70['ld(M1)'], label='Obtido por LTSpice')
plt.plot(vgs12_70['v1'],get_B(vgs12_70['v1'].values,B),label='Após fitting')
plt.yscale('log')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))
def get Id(Vgs, Vds, Vt, n, L, B):
return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:B*((Vgs-Vt)**n)* (1+L*Vds)])
Id2=get_Id(np.arange(0,1.21,0.01),1.2,Vt,n,L,B)
plt.figure()
plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm com Vds=1.2 V')
plt.ylabel('Id')
```

DEE / FCT-UNL 19 / 23

EDA/CAD: Relatório - Lab1



DEE / FCT-UNL 20 / 23



### Trabalho1 700nm.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Mon Apr 12 10:59:50 2021
@authors: Rafael, Francisco, José
import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve fit
os.chdir('G:\\O meu disco\\MIEEC\\5º Ano\\2º Semestre\\EDA\\Trabalho 1')
#Dados para Id(Vgs,1.2)
vgs12 700=pd.read csv('ld Vgs 12 700nm.txt',sep='\t')
#Dados para Id(Vds), com os 4 ensaios realizados (0.3, 0.6, 0.9, 1.2)
vds 700=pd.read csv('Id Vds 700nm.txt',sep='\t')
#Carregar os dados de Id(Vds) para uma dataframe, de modo a ter os 4 ensaios separados
U=[]
U.append(vgs12_700['v1'])
for i in range(0,4,1):
U.append(vds_700['ld(M1)'][1+i*122:122+i*122].to_numpy())
# i*122 - offset entre ensaios, contabilizando a linha da string
vds_700 = pd.DataFrame(U).transpose()
vds 700.columns = ['Vgs','0.3','0.6','0.9', '1.2']
del U, i
plt.figure()
plt.title('Id(Vds) para W=L=700nm')
plt.ylabel('Id')
plt.xlabel('Vds')
for vgs in np.arange(0.3,1.5,0.3):
plt.plot(vds_700['Vgs'], vds_700[str(round(vgs,2))],label='Vgs=%.1f V' %vgs)
plt.plot(vds 700['Vgs'][100], vds 700['1.2'][100], 'o', vds 700['Vgs'][120], vds 700['1.2'][120], 'o')
plt.legend(bbox to anchor=(1, 1))
plt.grid(linewidth=0.5)
plt.figure()
plt.title('Id(Vgs) para W=L=700nm')
plt.ylabel('Id')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12_700['v1'],vgs12_700['ld(M1)'], label='Vds=1.2 V')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.grid(linewidth=0.5)
def gm(Id,Vgs): #gm= dId/dVgs
return np.diff(Id)/np.diff(Vgs)
def get n vt(Vgs, n, Vt):
return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:(Vgs-Vt)/n])
def get lambda(ld1,ld2,Vds1,Vds2):
return (Id1-Id2)/(Id2*Vds1-Id1*Vds2)
```

DEE / FCT-UNL 21 / 23



```
def get B(Vgs, B):
return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt], [lambda Vgs:0, lambda Vgs:B*((Vgs-Vt)**n)*(1+L*1.2)])
# Obtenção dos valores de gm
gm_700 = gm(vgs12_700['ld(M1)'],vgs12_700['v1'])
# Obtenção dos valores de Id/gm
id_gm_700=(vgs12_700['ld(M1)'][1:]/gm_700).to_numpy()
#Obtenção de n e Vt
xx,xy=curve_fit(get_n_vt,vgs12_700['v1'][1:].values,id_gm_700)
n=xx[0]
Vt=xx[1]
#Obtenção dos valores Id/gm após o fitting
id_gm_new=get_n_vt(vgs12_700['v1'][1:].values,n,Vt)
#Obtenção de Lambda
L=get_lambda(vds_700['1.2'][100], vds_700['1.2'][120], vds_700['Vgs'][100], vds_700['Vgs'][120])
#Obtenção de B
xx, xy = curve\_fit(get\_B, vgs12\_700['v1']. values, vgs12\_700['ld(M1)']. values)
B=xx[0]
del xx, xy
#Id/gm antes e após fitting
plt.figure()
plt.title('Id/gm para W=L=700nm com Vds=1.2 V')
plt.ylabel('Id/gm')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12_700['v1'][1:],id_gm_700, label='Obtido por LTSpice')
plt.plot(vgs12_700['v1'][1:],id_gm_new, label='Após fitting')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.grid(linewidth=0.5)
#Id(Vgs) com Vds = 1.2 V antes e após fitting
plt.figure()
plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm com Vds=1.2 V')
plt.ylabel('Id')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12_700['v1'],vgs12_700['ld(M1)'], label='Obtido por LTSpice')
plt.plot(vgs12 700['v1'],get B(vgs12 700['v1'].values,B),label='Após fitting')
plt.legend(bbox to anchor=(1, 1))
#Id(Vgs) com Vds = 1.2 V antes e após fitting em escala logarítmica
plt.figure()
plt.title('Id(Vgs) para W=L=700nm com Vds=1.2 V')
plt.ylabel('Id')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12 700['v1'],vgs12 700['ld(M1)'], label='Obtido por LTSpice')
plt.plot(vgs12 700['v1'],get B(vgs12 700['v1'].values,B),label='Após fitting')
plt.yscale('log')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))
def get_Id(Vgs, Vds, Vt, n, L, B):
return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:B*((Vgs-Vt)**n)*(1+L*Vds)])
Id2=get_Id(np.arange(0,1.21,0.01),1.2,Vt,n,L,B)
plt.figure()
plt.title('Id(Vgs) para W=L=700nm com Vds=1.2 V')
plt.ylabel('Id')
plt.xlabel('Vgs')
plt.plot(vgs12_700['v1'],get_B(vgs12_700['v1'].values,B),label='Após fitting')
plt.plot(vgs12_700['v1'],Id2, label='através de get_Id')
```

DEE / FCT-UNL 22 / 23

EDA/CAD: Relatório - Lab1



DEE / FCT-UNL 23 / 23